

FAPG150 全自動單面探針台

針對功率型DIODE、MOSFET、IGBT等組件的晶圓測試

PEGASUS FAPG150是一台單面自動化探針結構的探針台，手臂自動取晶圓至預對準器調平及點測位置測試，可提供穩定且快速的測試環境，針對不同應用設定最佳的點測速度與針痕，並可因客戶需求提供客製化的設計。



性能特點

- 簡易操作平台及搖桿設計
- 晶圓圖建立及編輯功能
- 中文Windows操作介面，操作簡易
- 可建立不同產品設定檔
- CCD Wafer自動調平及對位
- 模組化電控結構，易於維修
- 高精密馬達驅動，提供安靜的運行環境
- 可同時放置2組cassette
- 晶圓平邊(V notch)找尋及調整
- TTL/RS232通訊方式，可搭配各廠測試機
- 優越的點測速度與極佳的探針針痕
- 可因客戶需求進行客製化設計

FAPG150 全自動單面探針台

技術規格

X/Y軸

- 架構：高精度循環式滾珠螺桿
- 行程：285mm × 250mm
- 解析度：0.5 μm
- 精度：≤± 4 μm /203mm
- 重複性：≤± 4 μm /203mm

Z軸

- 行程：10mm
- 解析度：1 μm
- 精度：≤±4 μm
- 重複性：≤±4 μm

Theta軸

- 行程：±10度
- 解析度：0.001度

載盤

- 材質：高強度鋁合金
- 尺寸：可選擇4" ~ 8"
- 可選擇使用Hot Chuck

CCD 調平模組

- 可依客戶晶粒尺寸進行搭配
- 標準：1/3" 1024X768 CCD
- 0.5X 鏡頭(ROI: 9.6mm X 7.2mm)

顯微鏡

- 三眼體視顯微鏡
- LED環形光源
- 倍率：X0.67 ~ X4.5
- 目鏡：X10 or X20

外觀尺寸

- 950(D) × 1360(W) × 1730(H) mm
(含螢幕，不包含信號燈)

重量

- 550Kg(不含測試機)

真空

- 4-6Kgf/cm²

氣壓

- 0.5MPa